

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ НИОКР: СЕМИНАР И ДЕЛОВАЯ ИГРА



ФОРМАТ: ОЧНО; ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА: НЕ ОГРАНИЧЕНО;
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ: НЕ БОЛЕЕ 50.

ОПИСАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сессия Проектного офиса ФИПС ориентирована на формирование у аудитории представления о возможностях патентной аналитики при решении критически важных для современной компании задач:

- объективный выбор и ранжирование перспективных НИОКР для включения в программы научно-технического и инновационного развития государства и отраслевых компаний;
- отбор инновационных технологических проектов научных, проектных, конструкторских и других организаций по планам научно-технического развития.

Сессия включает семинар (30 минут) и деловую игру (2 часа 30 минут).

СЕМИНАР (30 МИНУТ)

В рамках семинара будут представлены подходы и практики повышения объективности и учёта большего числа факторов при оценке перспективности и отборе НИОКР / инвестиционных технологических проектов для финансирования в рамках планов научно-технического развития ОАО "РЖД".

В ходе семинара предполагается обсудить:

- существующие подходы к отбору перспективных НИОКР, технологических и инновационных проектов, узкие места в оценке перспективности: многообразие и противоречивость источников информации, неопределённость компетенций и лояльности привлекаемых экспертов, упрощённые критерии оценки;
- направления эволюции подходов и техник оценки перспективности НИОКР и технологических проектов;
- ценность и уникальность патентной информации в применении к задаче отбора перспективных НИОКР и технологических проектов;

- систему показателей и оснований (новизна, междисциплинарность и другие) для объективной и всесторонней оценки НИОКР и технологических проектов;
- сценарии использования сервиса оценки перспективных проектов (на базе патентной аналитики) в интересах заказчика;
- управления интеллектуальными алгоритмами оценки на стороне заказчика и подстройки алгоритмов «под себя»;
- методическую подготовку специалистов заказчика для решения задач оценки перспективности НИОКР и инвестиционных технологических проектов научных, проектных, конструкторских и других организаций по планам научно-технического развития заказчика.

Отдельной секцией семинара будет короткий мозговой штурм, посвящённый на поиск места этих инструментов в существующих подходах и методах, принятых у заказчика для повышения эффективности процессов и процедур отбора НИОКР / инвестиционных технологических проектов.

ДЕЛОВАЯ ИГРА (2 ЧАСА 30 МИНУТ)

Деловая игра ориентирована на более глубокое погружение участников в специфику применения разных показателей патентной аналитики в интересах оценки перспективности НИОКР.

По результатам деловой игры у аудитории сформируется понимание:

- как отдельные показатели патентной аналитики влияют на общие рейтинги перспективности НИОКР (актуальность, новизна, междисциплинарность и другие);
- как осуществляется сборка комбинаций показателей патентной аналитики в общие рейтинги перспективности НИОКР;
- в какой степени на стороне заказчика может выполняться расширение и адаптация состава показателей патентной аналитики;
- по каким измерениям (временной, территориальный и другие разрезы) можно формировать новые показатели патентной аналитики;
- как выполняется формализация технических предложений о перспективных НИОКР и как формализованные профили НИОКР (в парадигме «проблема-решение») используются для расчёта показателей патентной аналитики;
- какая методическая база (подходы к профилированию НИОКР и рекомендации по содержательной интерпретации аналитических представлений) используется как основа постоянно действующих процессов оценки перспективности НИОКР и инвестиционных технологических проектов.

Деловая игра предполагает деление аудитории на группы по 5-7 человек (не более 10 групп).

Для каждой группы будут подготовлены практические задания по:

- группированию частных показателей патентной аналитики в общие рейтинги оценки перспективности НИОКР;
- оценке весов важности показателей патентной аналитики для расчёта разных общих рейтингов перспективности НИОКР;
- разработке новых показателей патентной аналитики на основе подготовленной системы измерений (временной, территориальной и другие разрезы);
- выявлению новых показателей патентной аналитики на основе анализа научных публикаций последних лет (для участников со знанием английского языка).